

SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1749 z dnia 7 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 421 z dnia 14 grudnia 2020 r.)

1. Strona 94, pozycje 2B206.c.1 i 2B206.c.2 powinny mieć brzmienie:
 - „1. zawierające »laser«; oraz
 2. zdolne, by utrzymać, przez co najmniej 12 godzin, przy temperaturze ± 1 K (± 1 °C), w warunkach znormalizowanej temperatury i znormalizowanego ciśnienia, wszystkich z poniższych parametrów:
 - a. »rozdzielczość« w pełnym zakresie wynoszącą 0,1 μm lub lepszą; oraz
 - b. »niepewność pomiaru« równą lub lepszą (mniejszą) niż $(0,2 + L/2\ 000)$ μm (L oznacza zmierzoną długość w mm).”.
2. Strona 142, pozycje 3B001.f.3–3B001.g powinny mieć brzmienie:
 - „3. sprzęt specjalnie zaprojektowany do wytwarzania masek, spełniający wszystkie poniższe kryteria:
 - a. posiadający odchylaną, zogniskowaną wiązkę elektronów, jonów lub wiązkę »laserową«; oraz
 - b. spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. apertura plamki dla szerokości piku w połowie jego wysokości poniżej 65 nm i umiejscowienie obrazu poniżej 17 nm (średnia + 3 sigma); lub
 2. nieużywane;
 3. błąd nakładania drugiej warstwy mniejszy niż 23 nm (średnia + 3 sigma) na maskę;
 4. sprzęt zaprojektowany do wytwarzania przyrządów wykorzystujący metody bezpośredniego nadruku i spełniający wszystkie poniższe kryteria:
 - a. wykorzystujący odchylaną, zogniskowaną wiązkę elektronów; oraz
 - b. spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. minimalny rozmiar wiązki równy lub mniejszy niż 15 nm; lub
 2. błąd nakładania warstwy mniejszy niż 27 nm (średnia + 3 sigma);
 - g. maski i siatki optyczne zaprojektowane do układów scalonych wymienionych w pozycji 3A001;”.
3. Strona 160, pozycja 5E001.d powinna mieć brzmienie:
 - „d. »technologia«, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do »rozwoju« lub »produkcji« »monolitycznych mikrofalowych układów scalonych« (»MMIC«) wzmacniaczy specjalnie zaprojektowanych dla telekomunikacji i spełniających którekolwiek z poniższych kryteriów:

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 5E001.d parametr mocy wyjściowej na granicy nasycenia może być również określany w arkuszu danych produktu jako moc wyjściowa, nasyciona moc wyjściowa, maksymalna moc wyjściowa, szczytowa moc wyjściowa lub szczytowa wartość obwiedni mocy.

 1. przystosowane do działania w zakresie częstotliwości powyżej 2,7 GHz i do 6,8 GHz włącznie, o »ułamekowej szerokości pasma« powyżej 15 % i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 75 W (48,75 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 2,7 GHz do 2,9 GHz włącznie;
 - b. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 55 W (47,4 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 2,9 GHz do 3,2 GHz włącznie;
 - c. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 40 W (46 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 3,2 GHz do 3,7 GHz włącznie; lub
 - d. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 20 W (43 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 3,7 GHz do 6,8 GHz włącznie;

2. przystosowane do działania w zakresie częstotliwości powyżej 6,8 GHz i do 16 GHz włącznie, o »uławkowej szerokości pasma« powyżej 10 % i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 10 W (40 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 6,8 GHz do 8,5 GHz włącznie; lub
 - b. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 5 W (37 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 8,5 GHz do 16 GHz włącznie;
 3. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 3 W (34,77 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 16 GHz do 31,8 GHz włącznie, i przy »uławkowej szerokości pasma« wynoszącej powyżej 10 %;
 4. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 0,1 nW (– 70 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 31,8 GHz do 37 GHz włącznie;
 5. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 1 W (30 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 37 GHz do 43,5 GHz włącznie, i przy »uławkowej szerokości pasma« wynoszącej powyżej 10 %;
 6. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 31,62 mW (15 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 43,5 GHz do 75 GHz włącznie, i przy »uławkowej szerokości pasma« wynoszącej powyżej 10 %;
 7. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 10 mW (10 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 75 GHz do 90 GHz włącznie, i przy »uławkowej szerokości pasma« wynoszącej powyżej 5 %; lub
 8. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 0,1 nW (– 70 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 90 GHz;”
4. Strona 175, pozycja 6A002.a.1 powinna mieć brzmienie:

„1. następujące detektory półprzewodnikowe »klasy kosmicznej«:

Uwaga: Do celów pozycji 6A002.a.1. detektory półprzewodnikowe obejmują »matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej«.

a. detektory półprzewodnikowe »klasy kosmicznej« spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1. reakcja szczytowa w zakresie długości fal z przedziału powyżej 10 nm, ale nieprzekraczającej 300 nm; oraz
2. w zakresie fal o długości powyżej 400 nm reakcja słabsza niż 0,1 % reakcji szczytowej;

b. detektory półprzewodnikowe »klasy kosmicznej« spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1. reakcja szczytowa w zakresie długości fal z przedziału powyżej 900 nm, ale nieprzekraczającej 1 200 nm; oraz
2. »stała czasowa« reakcji 95 ns lub poniżej;

c. detektory półprzewodnikowe »klasy kosmicznej« posiadające reakcję szczytową w zakresie długości fal powyżej 1 200 nm, ale nieprzekraczającej 30 000 nm;

d. »matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej« »klasy kosmicznej« mające więcej niż 2 048 elementów na zespół i reakcję szczytową w paśmie fal o długości powyżej 300 nm, ale nieprzekraczającej 900 nm;”.

5. Strona 179, pozycje 6A002.b–6A002.f powinny mieć brzmienie:

„b. »monospektralne czujniki obrazowe« i »wielospektralne czujniki obrazowe« przeznaczone do zdalnego wykrywania obiektów i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. chwilowe pole widzenia (IFOV) poniżej 200 μ rad (mikroradianów); lub
2. przeznaczenie do działania w zakresie fal o długości powyżej 400 nm, ale nieprzekraczającej 30 000 nm oraz mające wszystkie następujące własności:
 - a. dostarczanie wyjściowych danych obrazowych w postaci cyfrowej; oraz
 - b. spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. są „klasy kosmicznej”; lub
 2. przeznaczenie do zastosowań lotniczych i zaopatrzenie w czujniki inne niż krzemowe oraz posiadające IFOV poniżej 2,5 miliradianów;

Uwaga: Pozycja 6A002.b.1. nie obejmuje kontrolą »monospektralnych czujników obrazowych« o reakcji szczytowej w paśmie fal o długości powyżej 300 nm, ale nieprzekraczającej 900 nm i obejmujących wyłącznie którykolwiek z poniższych detektorów innych niż »klasy kosmicznej« lub »matryc detektorowych płaszczyzny ogniskowej« innych niż »klasy kosmicznej«:

1. matryce CCD, niezaprojektowane ani niezmodyfikowane do osiągnięcia 'powielania ładunków'; lub
2. matryce CMOS, niezaprojektowane ani niezmodyfikowane do osiągnięcia 'powielania ładunków'.

c. urządzenia do 'bezpośredniego widzenia' wyposażone w którekolwiek z poniższych:

1. lampowe wzmacniacze obrazu wyszczególnione w pozycji 6A002.a.2.a. lub 6A002.a.2.b.;
2. »matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej« wyszczególnione w pozycji 6A002.a.3.; lub
3. detektory półprzewodnikowe wyszczególnione w pozycji 6A002.a.1.;

Uwaga techniczna:

Termin 'bezpośrednie widzenie' odnosi się do urządzeń tworzących obrazy przedstawiające widzialny dla człowieka obraz bez jego przetwarzania na sygnał elektroniczny przekazywany na ekran telewizyjny, niemogących zarejestrować ani utulić obrazu na drodze fotograficznej, elektronicznej ani żadnej innej.

Uwaga: Pozycja 6A002.c. nie obejmuje kontrolą poniższych urządzeń, jeżeli są wyposażone w fotokatody inne niż z GaAs lub GaInAs:

- a. przemysłowych lub cywilnych systemów alarmowych, systemów kontroli ruchu drogowego lub przemysłowego ani systemów zliczających;
- b. urządzeń medycznych;
- c. urządzeń przemysłowych stosowanych do kontroli, sortowania lub analizy właściwości materiałów;
- d. wykrywaczy płomieni do pieców przemysłowych;
- e. urządzeń specjalnie zaprojektowanych do celów laboratoryjnych.

d. następujące specjalne elementy pomocnicze do czujników optycznych:

1. chłodnice kriogeniczne »klasy kosmicznej«;
2. następujące chłodnice kriogeniczne inne niż »klasy kosmicznej«, posiadające źródło chłodzenia o temperaturze poniżej 218 K (-55°C):
 - a. pracujące w obiegu zamkniętym i charakteryzujące się średnim czasem do awarii (MTTF) lub średnim czasem międzyawaryjnym (MTBF) powyżej 2 500 godzin;
 - b. samoregulujące się minichłodnice Joula-Thomsona (JT) z otworkami o średnicy (na zewnątrz) poniżej 8 mm;
3. czujnikowe włókna optyczne o specjalnym składzie lub konstrukcji lub zmodyfikowane techniką powlekania, w celu nadania im właściwości umożliwiających reagowanie na fale akustyczne, promieniowanie termiczne, siły bezwładności, promieniowanie elektromagnetyczne lub jądrowe;

Uwaga: Pozycja 6A002.d.3. nie obejmuje kontrolą czujnikowych włókien optycznych w obudowie specjalnie zaprojektowanych do stosowania jako czujniki w odwiertach.

- e. nieużywane.
- f. 'układy odczytujące' ('ROIC') specjalnie zaprojektowane do »matryc detektorowych płaszczyzny ogniskowej« określonych w pozycji 6A002.a.3.

Uwaga: Pozycja 6A002.f. nie obejmuje kontrolą 'układów odczytujących' specjalnie zaprojektowanych do zastosowań cywilnych w motoryzacji.

Uwaga techniczna:

'Układ odczytujący' ('ROIC') oznacza układ scalony zaprojektowany jako podstawa lub element połączony »matrycy detektorowej płaszczyzny ogniskowej« («FPA») i stosowany do odczytu (tj. odczytywania i rejestrowania) sygnałów wytwarzanych przez elementy detekcyjne. 'ROIC' co najmniej odczytuje ładunek z elementów detekcyjnych, ekstrahując ładunek i stosując funkcję multipleksową w sposób, który zachowuje informacje dotyczące względnej pozycji w przestrzeni i orientacji elementów detekcyjnych do przetwarzania w ramach 'ROIC' lub poza nim.".
